



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 428 906 A2**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 90120506.2

51 Int. Cl.⁵: **H01J 37/244, H01J 37/12**

22 Anmeldetag: 25.10.90

30 Priorität: 21.11.89 DE 3938660

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
29.05.91 Patentblatt 91/22

84 Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT NL

71 Anmelder: ICT Integrated Circuit Testing
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH
Klausnerring 1a
W-8011 Helmstetten(DE)

72 Erfinder: Frosien, Jürgen, Dr.-Ing.
An der Ottosäule 18
W-8012 Ottobrunn(DE)
Erfinder: Spehr, Rainer, Dr.
Erfurterstrasse 19
W-6105 Ober-Ramstadt(DE)

74 Vertreter: Tetzner, Volkmar, Dr.-Ing. Dr. jur.
Van-Gogh-Strasse 3
W-8000 München 71(DE)

54 **Korpuskularstrahlgerät.**

57 Die Erfindung betrifft ein Korpuskularstrahlgerät, wie Ionenstrahlgerät oder Elektronenstrahlgerät, bei dem ein Korpuskular-Primärstrahl mittels einer Objektivlinse auf eine Probe fokussiert wird. Die im Auftreffpunkt des Primärstrahls emittierte Sekundärstrahlung wird auf die mittlere, mit Szintillationsmaterial belegte Elektrode der Objektivlinse beschleunigt und erzeugt dort Lichtpulse, die von einem lichtempfindlichen Detektor in elektrische Signale umgewandelt und verstärkt werden.

EP 0 428 906 A2

KORPUSKULARSTRAHLGERÄT

Die Erfindung betrifft ein Korpuskularstrahlgerät entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Geräte der im Oberbegriff des Anspruchs vorausgesetzten Art sind aus der Praxis bekannt.

Korpuskularstrahlgeräte werden heute zur Mikrobearbeitung von Proben, wie beispielsweise zum Abtragen oder Aufbringen von Materialien, sowie in der Analytik eingesetzt. Arbeiten diese Geräte im Abbildungsmodus, wird der Korpuskular-Primärstrahl auf eine Probe fokussiert und die dabei emittierte Sekundärstrahlung detektiert und aufgezeichnet.

Dadurch entsteht eine Abbildung der Probenoberfläche in Abhängigkeit der Sekundärstrahlung. Mit zunehmender Auflösung der Geräte verkleinert sich entsprechend der Korpuskular-Sondendurchmesser, so daß entsprechend der Beziehung

$$i = R \cdot \pi/4 \cdot d^2 \cdot \alpha^2$$

der Strom i der Primär-Korpuskularsonde abnimmt. Hierbei bedeuten

R = der Richtstrahlwert der Korpuskularquelle,

d = Sondendurchmesser der Korpuskularsonde

α = zur Erreichung des Sondendurchmessers d zulässiger Aperturwinkel der Objektlinse.

Infolgedessen verringert sich auch die emittierte Sekundärstrahlung, so daß sich das Signal-Rauschverhältnis S/R verschlechtert. Zur Aufnahme hochwertiger Bilder mit gutem Signal-Rauschverhältnis S/R müssen daher lange Bildaufnahmezeiten verwendet werden.

Bei den bekannten Korpuskularstrahlgeräten werden zum Nachweis der Sekundärstrahlung Detektoren eingesetzt, die zwischen der fokussierenden Objektlinse und der Probe angeordnet sind. Dabei wird die emittierte Sekundärstrahlung durch eine entsprechend vorgespannte Elektrode von der Probe abgesaugt und auf einen Szintillator beschleunigt. Das dort erzeugte Licht wird in einem Fotomultiplier in ein elektrisches Signal umgewandelt und verstärkt. Andere Detektoren verstärken die abgesaugte Sekundärstrahlung direkt, ohne den Umweg über den Szintillator.

Das Absaugfeld derartiger Anordnungen wirkt sich jedoch nachteilig auf den Primärstrahl aus. Es lenkt einerseits den Primärstrahl ab und bewirkt andererseits eine Sondenaufweitung.

Die mit besonders feinen Sonden arbeitenden, hochauflösenden Geräte müssen mit kleinem Abstand zwischen Objektlinse und Probe, d.h. mit sehr kurzen Brennweiten arbeiten, um die Linsenfehler ausreichend klein zu halten. Dies wiederum führt beim Absaugen der Sekundärstrahlung mit herkömmlichen Detektoranordnungen zu weiteren Schwierigkeiten. Zum einen nimmt der Durchgriff der Absaugfeldstärke mit kleiner werdendem Ar-

beitsabstand ab und zum anderen kommt durch die Nähe des elektrostatischen Fokussierfeldes der Objektlinse ein weiteres, konkurrierendes Absaugfeld hinzu. Beide Tatsachen verschlechtern das Auffangen und Nachweisen der Sekundärstrahlung.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, das im Oberbegriff des Anspruchs 1 vorausgesetzte Korpuskularstrahlgerät dahingehend weiterzuentwickeln, daß es sich beim Auffangen und beim Nachweis der Sekundärstrahlung durch eine hohe Effizienz auszeichnet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 gelöst.

Durch Verwendung der mittleren Elektrode der elektrostatischen Objektlinse als Absaugelektrode kann nahezu die gesamte Sekundärstrahlung auf der mittleren Elektrode aufgefangen werden. Ein dort vorhandenes Szintillatormaterial wandelt die Sekundärstrahlung in Lichtpulse um. Dadurch ist es möglich, Abbildungen der Probe mit optimiertem Signal-Rauschabstand S/R in kürzester möglicher Zeit aufzunehmen.

Mit einer derartigen Anordnung wird zwischen der Objektlinse und der Probe kein Platz für eine Detektoranordnung benötigt, so daß der Arbeitsabstand und hierdurch die Linsenfehler der Objektlinse klein gehalten werden können.

Ein weiterer Vorteil dieser Anordnung liegt in dem rotationssymmetrischen, elektrostatischen Feld der mittleren Elektrode, das keine negativen Auswirkungen auf den Primärstrahl hat, insbesondere keine unbeabsichtigten Ablenkungen oder Sondenaufweitungen.

Weitere Merkmale der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche und werden im Zusammenhang mit der Zeichnung und der folgenden Beschreibung näher erläutert.

In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung des Korpuskularstrahlgerätes,

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung durch ein erstes Ausführungsbeispiel einer Objektlinse und einer lichtübertragenden Einheit,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung durch ein zweites Ausführungsbeispiel einer Objektlinse und einer lichtübertragenden Einheit,

Fig. 4 eine Schnittdarstellung durch ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Objektlinse,

Fig. 5 eine Schnittdarstellung durch ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Objektlinse.

In Fig. 1 ist ein Korpuskularstrahlgerät 1 schematisch dargestellt. Es enthält eine nicht dargestellte Einrichtung zur Erzeugung eines Korpuskular-Primärstrahls 2, der durch eine elek-

trostatische Objektivilinse 3 auf eine Probe 4 fokussiert wird. Der Primärstrahl 2 kann dabei je nach Anwendung durch einen Ionenstrahl oder durch einen Elektronenstrahl gebildet werden.

Die elektrostatische Objektivilinse 3 weist drei Elektroden 3a, 3b und 3c auf, die als ebene Ringscheiben ausgebildet sind. Die drei Elektroden 3a, 3b und 3c sind in Richtung des Primärstrahls 2 hintereinander angeordnet, wobei die Achse des Primärstrahls 2 mit der Achse 3d der Objektivilinse 3 zusammenfällt.

Eine die Öffnung der mittleren Elektrode 3b umschließende schmale Ringzone dieser Elektrode ist zumindest auf der der Probe 4 abgewandten Seite mit Szintillatormaterial versehen, das einen Szintillator 5 bildet. Über der elektrostatischen Objektivilinse 3 ist ein lichtempfindlicher Detektor 6, wie beispielsweise ein Fotomultiplier, angeordnet, der auf den Szintillator 5 der mittleren Elektrode 3b ausgerichtet ist.

Der in Fig.1 dargestellte, durch die Objektivilinse 3 fokussierte positive Ionenstrahl 2 erzeugt im Auftreffpunkt A der Probe 4 eine Sekundärstrahlung. Bei der Objektivilinse sind die beiden äußeren Elektroden 3a und 3c auf Masse gelegt, während die mittlere Elektrode 3b ein stark positives Potential aufweist. Dadurch werden die negativen Teilchen der Sekundärstrahlung, wie beispielsweise Elektronen, auf die mittlere Elektrode 3b und damit auf den Szintillator 5 beschleunigt (Zeile 7). Die auf dem Szintillator 5 auftreffende Sekundärstrahlung erzeugt Lichtpulse, die in den Fotomultiplier 6 gelangen (gestrichelte Pfeile 8) und dort in elektrische Signale umgewandelt und verstärkt werden.

Für die Beschleunigung der Sekundärstrahlung auf den Szintillator 5 wird keine zusätzliche Spannung benötigt, da der Szintillator 5 durch seine Ankoppelung an die mittlere Elektrode 3b ein ausreichend hohes Potential besitzt.

Da sich der Szintillator 5 innerhalb der Objektivilinse 3 befindet, kann der Arbeitsabstand b zwischen Objektivilinse 3 und Probe 4 klein gehalten werden, so daß hierdurch auch die Linsenfehler gering bleiben. Zudem können durch das rotationssymmetrische Feld der mittleren Elektrode 3b einerseits eine ungewollte Ablenkung und andererseits eine Sondenaufweitung im Auftreffpunkt A vermieden werden.

Bei der in Fig.2 dargestellten Objektivilinse 3 sind auf der unteren, der Probe 4 zugewandten Seite der mittleren Elektrode 3b Lichtleiter 9 angeordnet.

Im Betrieb werden die im Szintillator 5 erzeugten Lichtblitze nicht mehr direkt dem Fotomultiplier 6 zugeführt, sondern indirekt über die Lichtleiter 9.

In Fig.3 ist die lichtübertragende Einheit durch ein über der Objektivilinse 3 angeordnetes Spiegelsystem 10 verwirklicht. Die im Szintillator 5 erzeug-

ten Lichtpulse werden gemäß den gestrichelten Pfeilen 11 am Spiegelsystem 10 abgelenkt und dem Fotomultiplier 6 zugeführt.

Außer den bereits oben beschriebenen lichtübertragenden Einheiten, wie Lichtleiter 9 oder Spiegelsystem 10, kann auch ein Linsensystem verwendet werden.

Bei der in Fig.1 dargestellten Objektivilinse 3 weist die mittlere Elektrode 3b einen kleineren Öffnungsdurchmesser D_b auf als die beiden symmetrisch zur mittleren Elektrode 3b angeordneten und ausgebildeten Elektroden 3a und 3c.

In Fig.4 ist ebenfalls eine planare, elektrostatische Objektivilinse dargestellt, die jedoch einen asymmetrischen Elektrodenaufbau aufweist. Die der Probe zugewandte äußere Elektrode 3'c der Objektivilinse 3' weist einen kleineren Öffnungsdurchmesser D'_c auf als die beiden anderen Elektroden 3'a und 3'b. Der Durchmesser D'_b der mittleren Elektrode 3'b ist wiederum kleiner als der Durchmesser D'_a der der Probe abgewandten Elektrode 3'a.

In Fig.5 ist als weiteres Ausführungsbeispiel eine konische elektrostatische Objektivilinse 3'' dargestellt. Hierbei sind die Elektroden 3''a, 3''b und 3''c der Objektivilinse 3'' als sich in Richtung des Primärstrahls 2 verjüngende Konuselemente ausgebildet.

Im Rahmen der Erfindung sind alle Arten von elektrostatischen Objektivilinsen denkbar, wie beispielsweise Einzellinsen, flache und konische Bauformen sowie Immersionslinsen.

35 Ansprüche

1. Korpuskularstrahlgerät, wie Ionenstrahlgerät oder Elektronenstrahlgerät, enthaltend
 - a) eine Einrichtung zur Erzeugung eines Korpuskular-Primärstrahls (2),
 - b) eine den Primärstrahl (2) auf eine Probe (4) fokussierende, elektrostatische Objektivilinse (3), die drei in Strahlrichtung hintereinander angeordnete, rotationssymmetrische Elektroden (3a, 3b, 3c) enthält, wobei die Achse des Primärstrahls (2) mit der Achse (3d) der Objektivilinse (3) zusammenfällt,
 - c) eine die auf der Probe (4) am Auftreffpunkt (A) des Primärstrahls (2) emittierte Sekundärstrahlung absaugende Einrichtung,
 - d) einen im Strahlengang der Sekundärstrahlung angeordneten Szintillator (5), gekennzeichnet durch folgendes Merkmal:
 - e) der Szintillator (5) wird durch die mittlere Elektrode (3b) der Objektivilinse (3) gebildet.
2. Gerät nach Anspruch dadurch gekennzeichnet, daß der Korpuskular-Primärstrahl (2) durch einen Ionenstrahl gebildet wird.
3. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

net, daß der Korpuskular-Primärstrahl (2) durch einen Elektronenstrahl gebildet wird.

4. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektroden (3a, 3b, 3c) der Objektivlinse (3) als ebene Ringscheiben ausgebildet sind.

5

5. Gerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die mittlere Elektrode (3b) der Objektivlinse (3) einen kleineren Öffnungsdurchmesser (D_b) als die beiden symmetrisch zur mittleren Elektrode (3b) angeordneten und ausgebildeten Elektroden (3a, 3c) aufweist.

10

6. Gerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die der Probe zugewandte äußere Elektrode (3'c) der Objektivlinse (3') einen kleineren Öffnungsdurchmesser (D'_a) als die beiden anderen Elektroden (3'a, 3'b) aufweist, wobei die mittlere Elektrode (3'b) ihrerseits einen kleineren Öffnungsdurchmesser (D'_b) als die der Probe abgewandte Elektrode (3'a) aufweist.

15

7. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektroden (3''a, 3''b, 3''c) der Objektivlinse (3'') als sich in Richtung des Korpuskular-Primärstrahls (2) verjüngende Konuselemente ausgebildet sind.

20

8. Gerät nach Anspruch 1, bei dem an den Szintillator (5) ein lichtempfindlicher Detektor (6) angeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Szintillator (5) mit dem lichtempfindlichen Detektor (6) über eine lichtübertragende Einheit (9, 10), vorzugsweise einen Lichtleiter, ein Spiegelsystem oder ein Linsensystem, verbunden ist.

25

30

9. Gerät nach Anspruch 1, bei dem dem Szintillator (5) ein lichtempfindlicher Detektor (6) nachgeschaltet ist, gekennzeichnet durch eine direkte Abstrahlung des im Szintillator (5) erzeugten Lichtes zum lichtempfindlichen Detektor (6).

35

10. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine die Öffnung der mittleren Elektrode (3b, 3'b, 3''b) umschließende schmale Ringzone der mittleren Elektrode zumindest auf der der Probe abgewandten Seite mit Szintillationsmaterial versehen ist und den Szintillator (5) bildet.

40

45

50

55

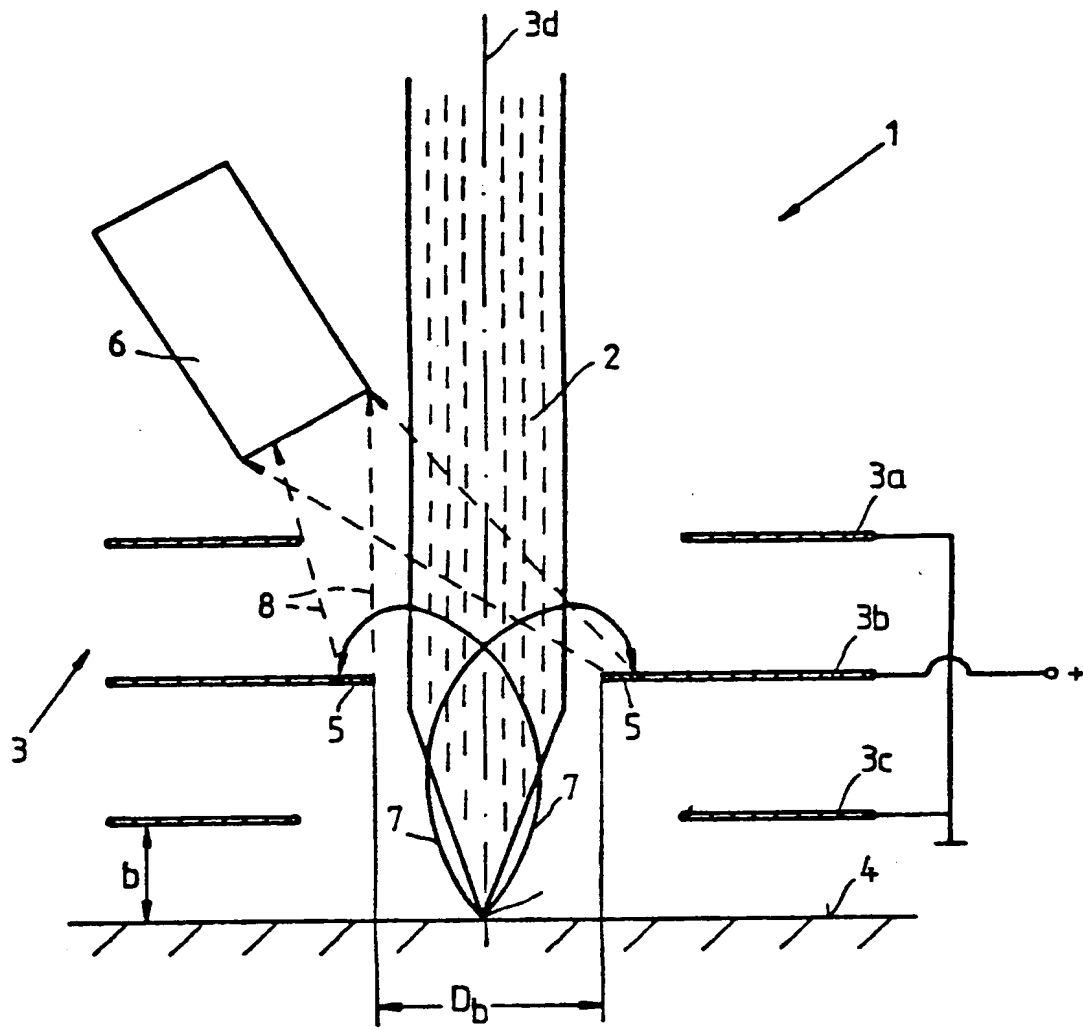


FIG. 1

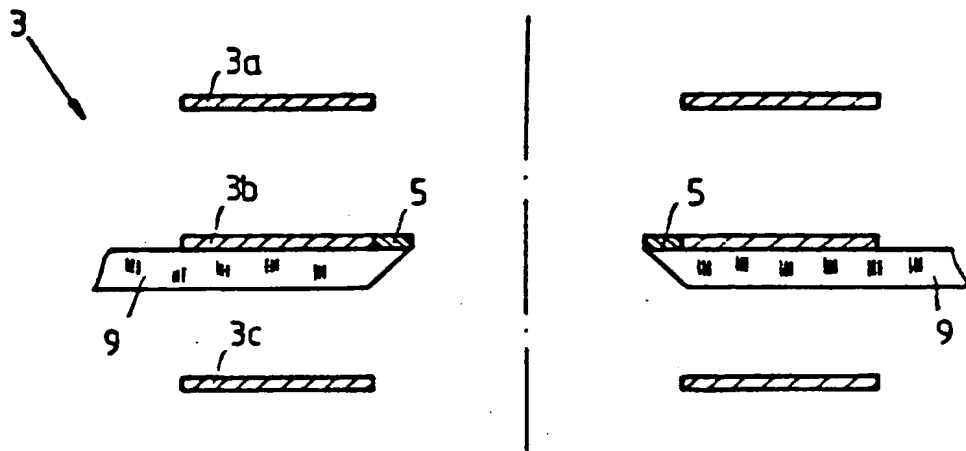


FIG. 2

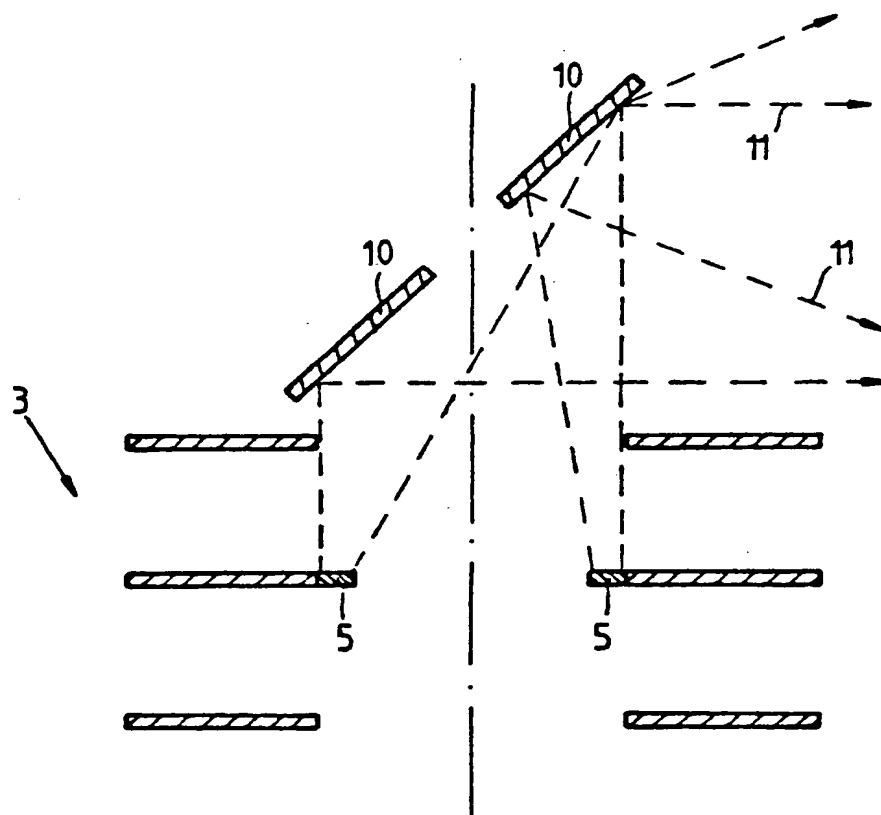


FIG. 3

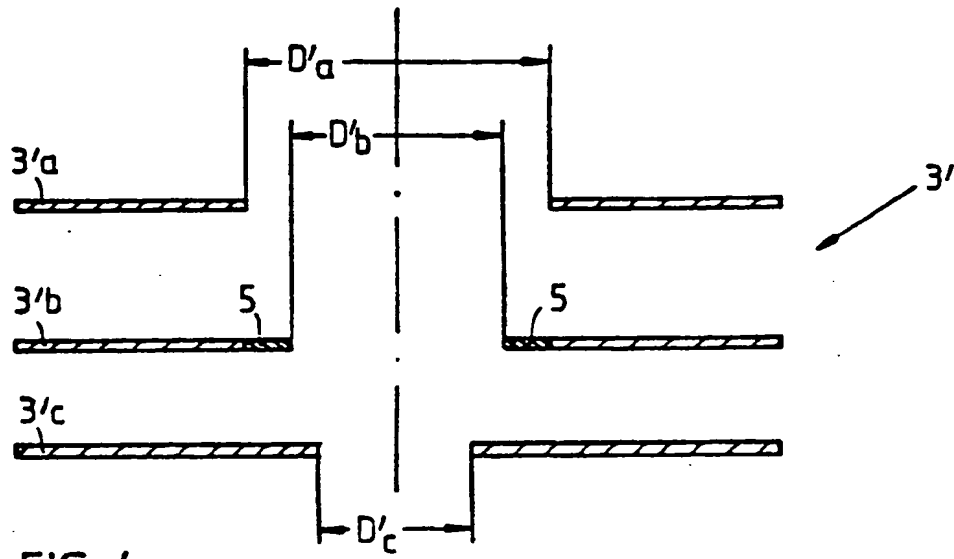


FIG. 4

FIG. 5

